

(12) पेटेंट आवेदन प्रकाशन

(19) भारत

(22) आवेदन फ़ाइल करने की तिथि : 06/03/2013

(21) आवेदन सं. 654/डीईएल/2013 ए

(43) प्रकाशन की तिथि: 23/01/2015

(54) खोज का शीर्षक : एक लाइनर ट्रांसड्यूसर के पैमाने के तापीय विस्तार के कारण माप की त्रुटियों को पूरा करने की एक प्रणाली के साथ उपलब्ध मापन मशीन

(51) अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण	:G01D	(71) आवेदक का नाम :
(31) प्राथमिकता दस्तावेज़ सं	:12425050.7	1) हेक्सागोन मेट्रोलॉजी एस.पी.ए.
(32) प्राथमिकता तिथि	:07/03/2012	आवेदक का पता: वाया विटिमे डी पियाजा डेला
(33) प्राथमिकता देश का नाम	:ईपीओ	लोगिया, 6, मोंकेलियरी, इटली
(86) अंतरराष्ट्रीय आवेदन सं	:लागू नहीं	(72) खोजकर्ता का नाम :
भरने की तिथि	:लागू नहीं	1) डोमेनिको रूसो
(87) अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन सं	:लागू नहीं	
(61) आवेदन सं. में जोड़ने का पेटेंट	:लागू नहीं	
भरने की तिथि	:लागू नहीं	
(62) आवेदन सं. में विभाजन संबंधी	:लागू नहीं	
भरने की तिथि	:लागू नहीं	

(57) सारांश :

एक मापन मशीन (1) जिसमें एक एक्सिस (वाय) के साथ एक सदस्य (5) मोबाइल, एक ऑप्टिकल स्केल (14) जो एक्सिस (वाय) के समानांतर बढ़ता है, एक पहला पठन हेड (15) जिसे 10 मोबाइल नंबर (5) द्वारा आगे बढ़ाया जाता है और ऑप्टिकल स्केल (14) के साथ सहयोग करता है, एक अतिरिक्त सेंसर (20) जिसे मोबाइल नंबर (5) द्वारा आगे बढ़ाया जाता है और एक प्रोसेसिंग यूनिट सम्मिलित है जो पहले पठन हेड (15) के साथ और ऑप्टिकल 15 स्केल (14) के तापीय विस्तार की अवस्था से संबंधित डेटा का पता लगाने के लिए अतिरिक्त सेंसर (20) के साथ सहयोग करता है।

पृष्ठों की सं.: 17 दावों की सं.: 10